

19.09.2024 W Kielcach odbyła się 2. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „New Trends in Metrology”

Autor : Elżbieta Sawerska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W zorganizowanej w dniach 16-18 września 2024 r. przez Polską Unię Metrologiczną, Politechnikę Lubelską i Główny Urząd Miar konferencji wzięło udział ok. 200 naukowców, inżynierów i specjalistów z całego świata, aby omówić najnowsze osiągnięcia i trendy w metrologii.

Ponadto, dzięki transmisji online, konferencję obserwowało kilkuset gości (odnotowano ponad 300 odtworzeń wydarzenia).

Głównymi prelegentami „New Trends in Metrology” byli:

- Miruna Dobre (kierownik badań oraz kierownik Laboratorium Termometrii w belgijskim Krajowym Instytucie Metrologii),
- prof. Luca de Vito (Uniwersytet Sannio w Benevento, Włochy),
- dr hab. inż. Zbigniew Humienny (Politechnika Warszawska), dr Piotr Sobiecki (kierownik Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji oraz Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej w Ośrodku Przetwarzania Informacji),
- dr Aime Lay Ekuakille (Uniwersytet w Salento, Włochy),
- prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz (kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Nieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku),
- Harald W. Scholz (SMARTEN).

Profesor Beata Godlewska-Żyłkiewicz w swoim referacie omówiła metrologiczne wyzwania związane z oznaczaniem NPs w żywności, problemy specyficzne dla techniki sp-ICP-MS oraz przykłady jej zastosowań.

Profesor Humienny wygłosił referat na temat "Dlaczego metrolog potrzebuje tolerancji geometrycznych na rysunku konstrukcyjnym wyrobu?"

Luca de Vito mówił o wykorzystaniu teorii próbki kompresyjnej (CS), co pozwala na znaczące zmniejszenie liczby punktów próbkowania potrzebnych do przechwytywania danych.

Wykład prof. Aimé Lay-Ekuakille z Uniwersytetu w Salento poświęcony był aparaturze diagnostycznej stosowanej w radiologii, aplikacjach biomedycznych oraz przemysłowych.

Na konferencji zostały zaprezentowane również wyniki badań naukowych, będące efektem realizacji grantów naukowych, prac własnych i statutowych uczelni wyższych, instytutów naukowych PAN oraz sieci badawczych.

Można było wziąć udział w wykładach plenarnych, panelach dyskusyjnych, sesjach plakatowych oraz tutorialach dotyczących:

- wykorzystania skanowania laserowego w automatyzacji procesów pomiarowych,
- automatyzacji pomiarów współrzędnościowych w kontroli jakości,
- ścieżce szkoleń metrologa współrzędnościowego,
- przechwytywania wysokiej jakości danych procesowych ze sterowania CNC.

Jednym z wydarzeń towarzyszących Konferencji była wizyta w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym GUM.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Unia Metrologiczna (PUM), organizacja założona w celu rozwoju i promocji metrologii w Polsce.

Wydarzenie objęte zostało patronatem:

Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, KBM PAN, Ministra Nauki, Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, Rektora Politechniki Lubelskiej, POLSAR.

Konferencję objęły patronatem medialnym: TVP Lublin, TVP Kielce, Radio Kielce, laboratoryjnie.pl, Forum Akademickie.

